

Skriptname: Wafer9.jsl
Datum: 23.08.2007

JMP-Version: JMP 7
Download: Wafer9.zip

Funktion

Das Skript erstellt 2-dimensionale Konturdiagramme für Messwerte auf Wafern (Wafermap)

Beschreibung

Zur Verwendung dieses Skripts benötigt man eine JMP-Datentabelle mit einer Spalte für die x-Koordinaten und einer Spalte für die y-Koordinaten der Messpunkte sowie Analysespalten mit den Messwerten. Gute Ergebnisse erhält man mit 50 bis 100 Messpunkten. Startet man das Skript mit einer solchen aktiven Tabelle, öffnet sich ein Dialog-Fenster (vgl. Abbildung 1).

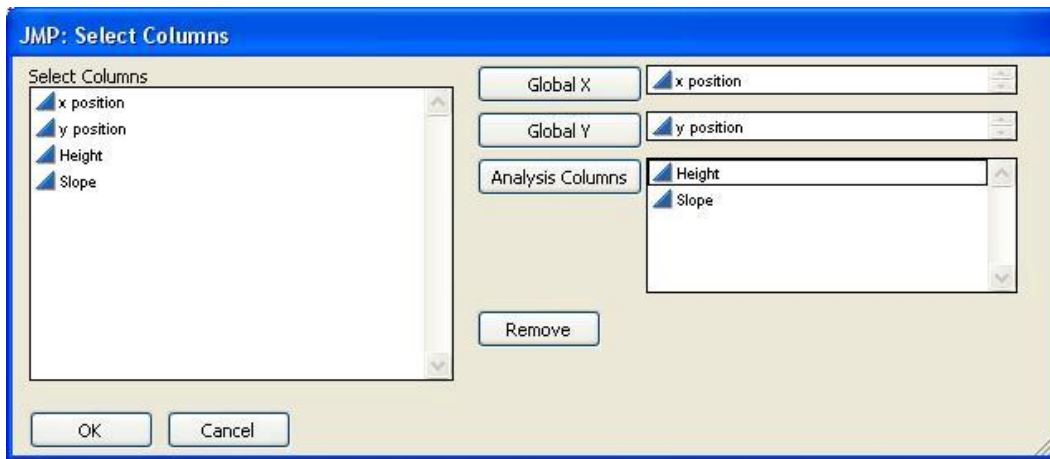


Abbildung 1: Das Dialog-Fenster

Hier sind die entsprechenden Spalten auszuwählen. Sie können mehrere Analysespalten gleichzeitig darstellen lassen, wenn Sie an den gleichen Messpunkten mehrere Messwerte erfasst haben. Klickt man auf OK, so wird im Hintergrund ein Gauß-Prozess an die Daten angepasst. Dies ist eine relativ komplexe Rechnung, die typischer Weise einige Zeit in Anspruch nimmt (und erst ab JMP 7 möglich ist). Anschließend wird mit Hilfe des Gaußmodells ein Konturdiagramm erstellt, und es werden einige elementare statistische Kenngrößen berechnet. Wenn mehrere Spalten analysiert wurden, befinden sich die zugehörigen Wafermap Reports nebeneinander im Ausgabefenster (vgl. Abbildung 2).

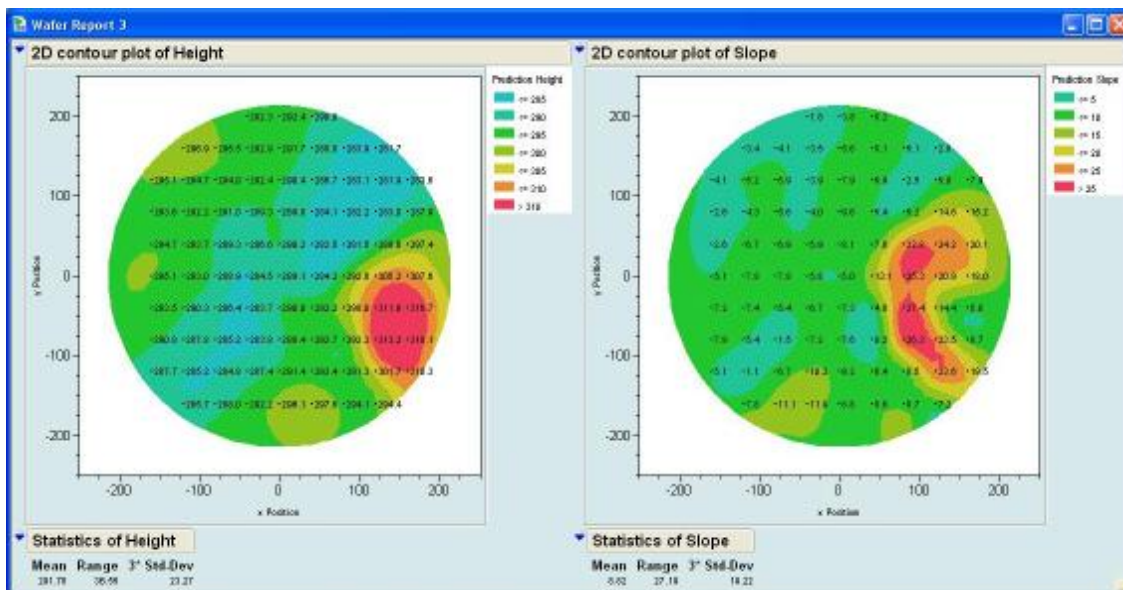


Abbildung 2: Ausgabe der Konturdiagramme für Wafer Daten (Wafermap)